

産総研 四国センター 新技術セミナー in 四国 先端分析技術セミナー

文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム事業
産総研 微細構造解析プラットフォーム
令和3年度 第2回地域セミナー

日時：2021年12月21日（火） 13:00～17:45

オンラインセミナー（Teamsで開催・事前登録制）
参加方法はお申込み頂いた方にご案内いたします。

事前登録締切：2021年12月14日（火）



申込方法：ANCF事務局 (ancf-info-ml@aist.go.jp)にメールでお申し込みください。
左のQRコードまたは下記URLからもお申し込みいただけます。
<https://forms.office.com/r/DvdSiHYR1T>

※セミナーのご参加にはインターネット環境が必要となります。
お申し込み時の記載事項（必須）：

お名前、所属（社名、組織名等）、Eメールアドレス
（任意）：ご住所（ANCFに関する資料をご希望の方はご記載ください）
個別相談の有無（希望装置と相談内容も簡単にご記載ください）

本件担当：産総研分析計測標準研究部門内・先端ナノ計測施設（ANCF）事務局



分析機器のこれからの展望する

オンライン
セミナー
無料

分析機器は機能性材料の開発や食品・医薬品などを含む種々の化学物質の試験・評価に欠かせません。一方機器自体の研究開発も日々進められ、新たな機器や技術が続々と登場しています。さらに分析計測技術は多くの基盤技術に支えられ、その進歩を実現しています。本セミナーでは、産総研の研究成果である分析機器・技術とそれらの先端ナノ計測施設（ANCF）での公開利用方法の紹介および分析計測技術を先導する基盤技術の卓越した研究成果のご講演を通して、最先端の分析機器のこれからの皆様とともに展望したいと思います。

ANCFは文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業の微細構造解析プラットフォーム及び今年度より同省マテリアル先端リサーチインフラ事業（ARIM）に参画しています。



- ◆主催 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 四国センター
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 先端ナノ計測施設（ANCF）
with 産総研微細構造解析プラットフォーム and 産総研マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）
- ◆共催 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム


プログラム

13:00 - 13:15	開会挨拶・概要および趣旨説明		中村 健
	I. 先端ナノ計測施設（ANCF）（つくば）の紹介（1）		
13:15 - 13:35	陽電子プローブマイクロアナライザー装置（PPMA）	装置概要	満汐 孝治
13:35 - 13:55	超伝導蛍光収量 X線吸収微細構造分析装置（SC-XAFS）	装置概要	志岐成友・藤井剛
13:55 - 14:15	超伝導蛍光 X線検出器付走査型電子顕微鏡（SC-SEM）	装置概要	藤井 剛
14:15 - 14:35	極端紫外光光電子分光装置（EUPS）	装置概要	石塚 知明
	～休憩～		
	II. 特別講演 ～分析計測の基盤としての材料とものづくり技術～		
14:45 - 15:15	超低ガス放出チタン材料による極高真空実現への挑戦		栗巢普揮 （山口大）
15:15 - 15:45	多層薄膜構造の作製とその分析計測への応用		竹中久貴 （(株)トヤマ）
	～休憩～		
	III. 先端ナノ計測施設（ANCF）（つくば）の紹介（2）		
15:55 - 16:15	リアル表面プローブ顕微鏡（RSPM）	装置概要	井藤 浩志
16:15 - 16:35	可視-近赤外過渡吸収分光装置（VITA）	装置概要	細貝 拓也
16:35 - 16:55	固体NMR装置（SSNMR）	装置概要	服部 峰之
16:55 - 17:05	利用方法説明	概要	松林 信行
17:05 - 17:10	閉会挨拶		原市 聡

17:15～17:45 ANCF個別相談会

ANCF各装置の個別の相談時間を設けます。ご希望の方はお申し込みの際にお申し出下さい。但し、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承下さい。